

## Charakteristika profilu povrchu :)

Štruktúru povrchu hodnotíme na základe veličín, ktoré sú normalizované v ISO 4287:1997. V uvedenej norme môžeme nájsť štruktúru povrchu charakterizovanú týmito parametrami:

- **P parameter** – jeho výpočet získavame z primárneho profilu,
- **R parameter** – jeho výpočet získavame z drsnosti,
- **W parameter** – jeho výpočet získavame z profilu vlnitosti.

Základné zdroje informácií získavame z tzv. profilu povrchu. Profil povrchu vzniká rezom skutočného profilu definovanou plochou. Pre meranie a vyhodnocovanie štruktúry povrchu sú jednotlivé profily definované nasledovne:

- Primárny profil (P – profil) – profil vzniká z rezu meraného povrchu rovinou kolmou k povrchu.
- Profil drsnosti (R – profil) – tento profil je základom pre určenie parametrov profilu drsnosti. R – profil sa odvodí z primárneho profilu potlačením zložiek s dlhou vlnovou dĺžkou, filtrom profilu  $\lambda_c$ .
- Profil vlnitosti (W – profil) – profil je základom pre určenie parametrov vlnitosti profilu. W – profil sa tak isto ako R – profil, odvádza z primárneho profilu pomocou  $\lambda_r$  a  $\lambda_c$  profilových filtrov.

Výpočtový systém, ktorý je uvedený v norme ISO 4287:1997 slúži na vyhodnocovanie parametrov profilu povrchu. Systém je založený na sústave strednej čiary, čiary profilu drsnosti, a strednej čiary primárneho profilu.

Štruktúry novovzniknutých profilov sa najčastejšie vyhodnocujú profilovou metódou, pomocou dotykových profilometrov. Rozloženie nerovností na povrchu sa prevádza na mechanický pohyb pomocou ostrého hrotu snímača profilometra. Mechanický pohyb je potom pomocou snímaču prevedený na elektrický signál. Elektrický signál je ďalej spracovávaný a uvádzaný, ako číselná hodnota zvoleného parametra, alebo ako grafický záznam profilu nerovností.